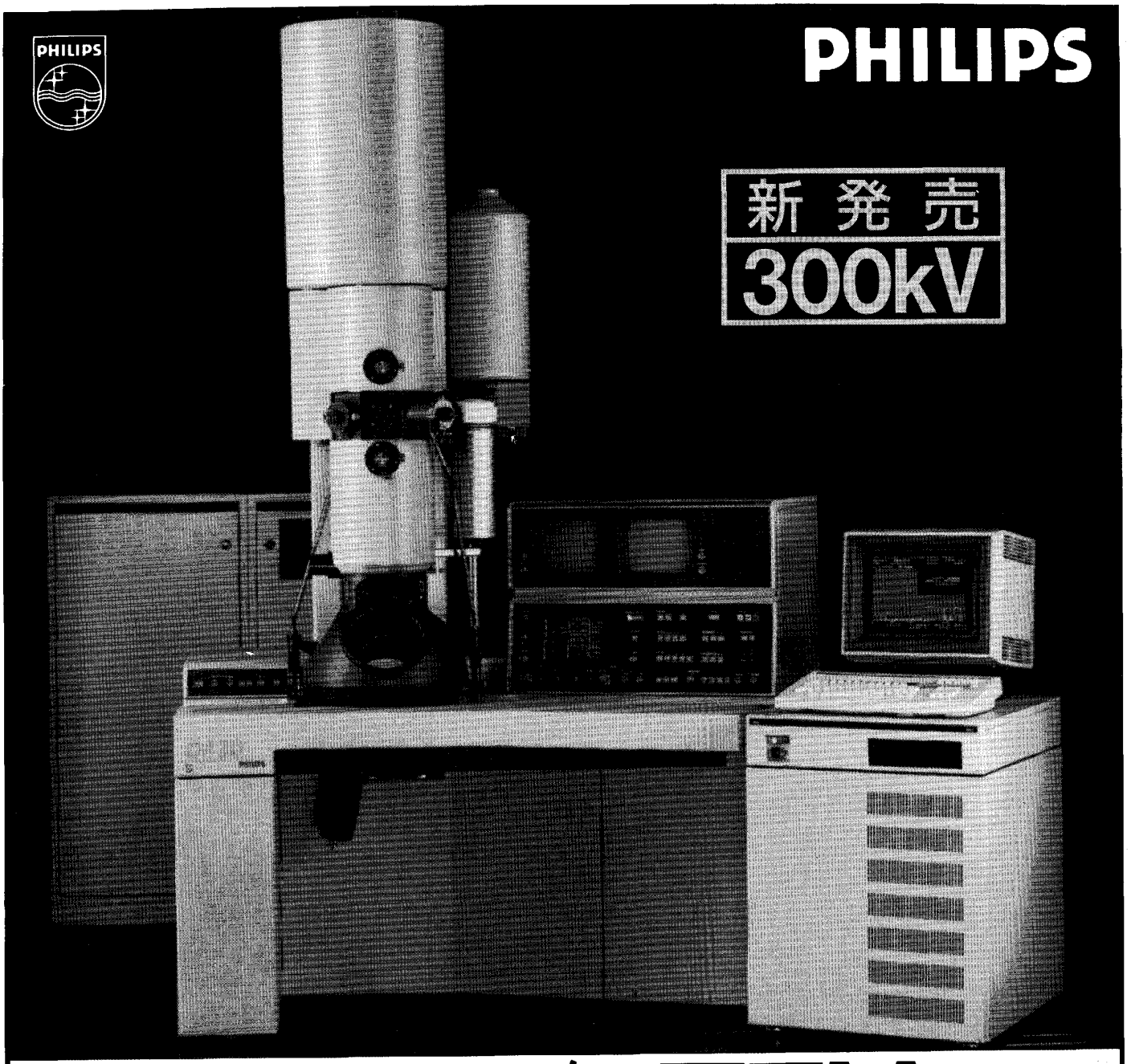
PHILIPS



CM30/STEM

総合電子顕微鏡

先端技術で機能は多く、操作つまみ数が少ない

■特長

- マイクロコントローラによる簡単な操作。
- 第3世代高性能ツインレンズによる高角度試料傾斜(±60°)と小さなレンズ収差係数。
- 投影角20度と大きい収束電子回折。
- IGP標準装備の独立2系統差動排気で超高真空(UHV)。
- 静寂な環境で観察できる。

■SPECIFICATIONS

OBJECTIVE LENS, RESOLUTION AND GONIOMETER

Objective	f	Cs	Cc
Probe forming lens	2.7mm	2.0mm	2.0mm
TEM imaging lens	2.7mm	2.0mm	2.0mm

Minimum TEM Probe Size	2.0 nm
TEM Point Resolution	0.23nm
TEM Line Resolution	0.14nm
Smallest Focus Step Size	3nm
Goniometer Eucentric Tilt for Standard Specimen Holder	±60°

SCANNING RESOLUTION

Resolution edge STEM-BF/DF 1.5nm

日本フィリップス株式会社
《産業機器事業部》

本　　社　〒108 東京都港区高輪3-26-33(秀和品川ビル) TEL(03)448-5770(直通)
大阪支店　〒541 大阪市東区今橋2－22(藤浪ビル) TEL(06)231-7871(代表)
筑波営業所　〒305 茨城県つくば市竹園2-8-6(つくしビル) TEL(0298)52-9940

昭和六十三年十月二十五日　印刷　発行　(毎月一回一日発行)　印刷人　東京都板橋区熊野町十三－十一　倉沢直則　郵便振替口座東京七－一九三番　(会費に含む)